

NVMe 調査・解析テスト



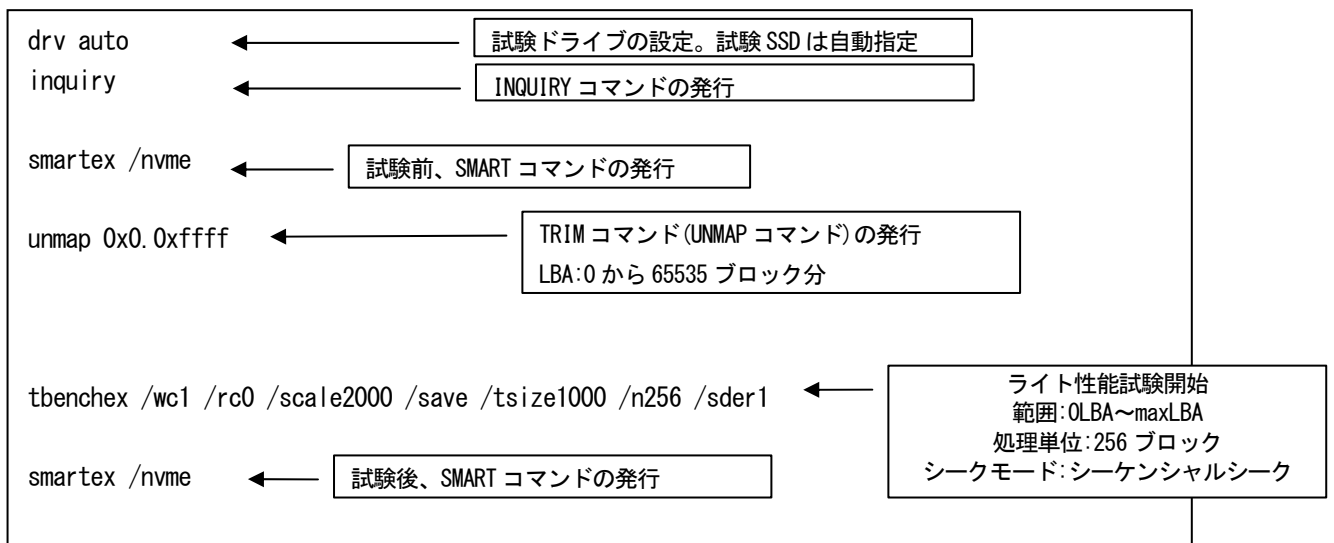
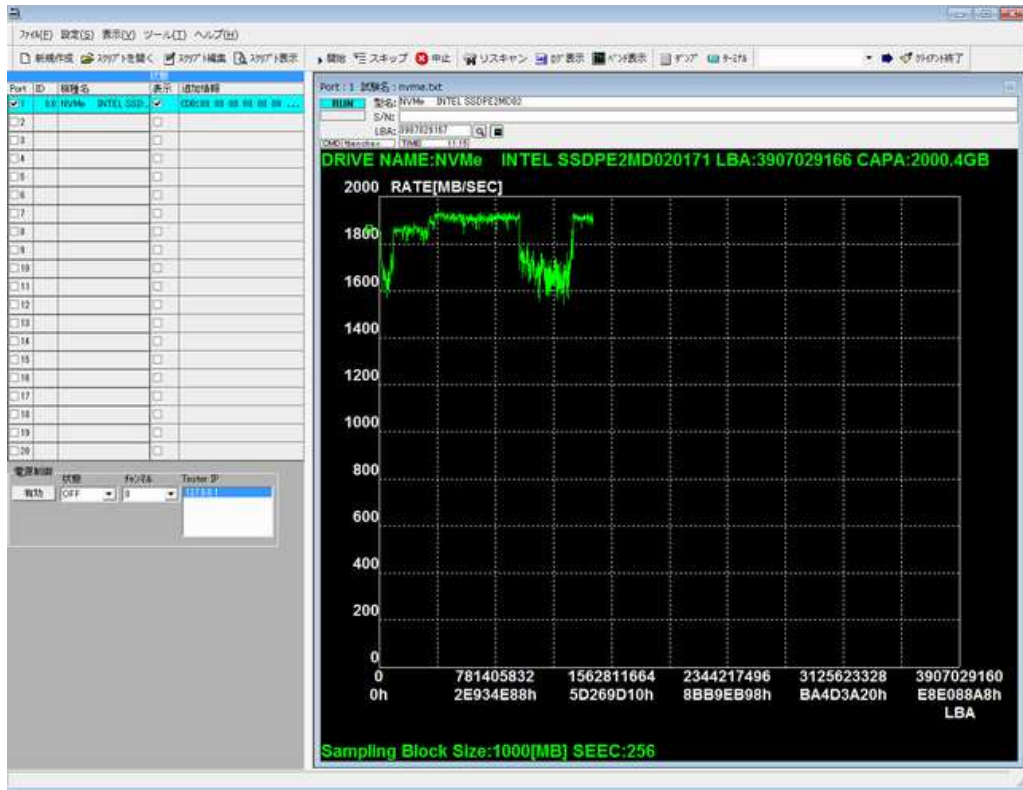
NVMe とは

HDD 用に定義されたインターフェース仕様(AHCI)では SSD の性能値を引き出せませんでした。そこで、より高速な SSD に最適化されているインターフェース仕様として NVMe が新たに定義されました。

NVMe・テストユニット (MIF-W522)

- ▶ NVMe デバイスがサポートしている SCSI コマンドの発行が可能
- ▶ SMART 値の読み込み、TRIM 試験が可能 (現状 Intel 社製デバイスに限る)
- ▶ 簡易スクリプトプログラム作成により NVMe デバイスに対して試験コマンドを任意のシーケンス、時間、回数で実行可能
- ▶ 弊社独自開発のアクセスパターンによるリード・ライト試験可能
実アプリに近い評価が実行可能
- ▶ OS は ROM 化されており、システムの安定性が向上
- ▶ ログは内部ストレージへ書き出し

スクリプトファイル・実行画面例



※改良のため仕様・意匠・価格等は予告なく変更することがあります。
 ※記載の商品名、名称等は各社の商標または登録商標です。
 ※このカタログは、2017年7月現在のものです。
 ※カタログの写真と実際の製品では一部異なる場合があります。

*HDD/SSDに関するどのような問題でもお気軽にご相談下さい。

お問い合わせは下記へ

三映電子工業株式会社
 〒385-0002 長野県佐久市上平尾 801
 Tel. 0267-78-5010 Fax. 0267-78-5011
 E-mail info@sanei-j.com URL http://www.sanei-j.com/
 東京営業 Tel. 03-5999-8801(代) Fax. 03-5999-8807

